

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#)   [Publications/Services](#)   [Standards](#)   [Conferences](#)   [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office

» Se.

[Help](#)   [FAQ](#)   [Terms](#)   [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

**Print Format**[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved